

超高分解能顕微鏡法分科会 研究会のご案内

日本顕微鏡学会 超高分解能顕微鏡法分科会では、毎年泊まり込みの研究会を開催しております。今年度は、計算科学の盛り上がりと、様々な検出器、手法がリリースされたことなどを受け、「顕微鏡データからの情報抽出」というテーマで開催致します。通常の学会講演よりも、より踏み込んだ議論の場となることを期待しています。是非、ご参加下さい。

- 開催日時：平成 30 年 2 月 23 日(金)13:00 より、24 日(土)12:00 迄
- 開催場所：マホロバマインズ三浦（最寄駅:京急線三浦海岸駅）
<https://www.maholova-minds.com/>
- 参加費：18,000 円(宿泊費・懇親会費込 宿泊を希望されない方はお問い合わせ下さい)
- 申込締切：平成 30 年1月 22 日(月)

〔確定済み講演、順不同・敬称略〕

- 基調講演：
「構造化データ融合法によるテンソル分解を適用したハイパー顕微分光データからの情報抽出」
名古屋大学 武藤俊介
 - 「光物性・放射光計測とデータ駆動科学の融合」
熊本大学 赤井一郎
 - 「電子線回折に最適化した diffractive imaging」
大阪大学 山崎順
 - 「ピクセル型 STEM 検出器 4DCanvas で得られた応用データとタイコグラフィーによる位相再構成」
日本電子 佐川隆亮
 - 「iDPC and 4DSTEM using the Electron Microscope Pixellated Array Detector (EMPAD)」
Thermo Fisher Scientific Alex Bright
 - 「Gatan 社製 TEM 用カメラを使用した高速 4D-STEM システム、STEMx」
日本ローパー ガタン事業本部 伊野家浩司
 - 「微分位相コントラスト法による電磁場定量の現状と展望」
東京大学 関岳人
 - 「境界条件を考慮した Poisson 方程式の解法:TIE および DPC への応用」
HREM 石塚顕在
 - 「スパース位相回復法によるコヒーレント軟 X 線回折磁気イメージング」
NIMS 山崎裕一
- 申込方法：氏名、所属、住所、電話番号、E-mail アドレス、顕微鏡学会の会員・非会員
または学生・性別を記入の上、E-mail にてお申し込み下さい。
なお、1室、3～5 名の相部屋となりますのでご了承ください。
(追加料金にて個室への変更も可能です)
 - 申込先：物質・材料研究機構 実働環境計測技術開発グループ 三石和貴
E-mail: Mitsuishi.Kazutaka@nims.go.jp 電話:029-863-5474 (直通)